

Rotation de TP - Semestre 8 | 2022-2023

ven. 6 janv.

Groupe TP 1 (mercredis) - 20 élèves										
Séance	Séquence 1			Séquence 2						
	mer. 25 janv.	mer. 1 févr.	mer. 8 févr.	mer. 1 mars	mer. 8 mars	mer. 15 mars	mer. 22 mars	mer. 29 mars	mer. 5 avr.	mer. 12 avr.
CR	mer. 1 févr.	mer. 8 févr.	mer. 15 févr.	mer. 8 mars	mer. 15 mars	mer. 22 mars	mer. 29 mars	mer. 5 avr.	mer. 12 avr.	
TP1.1	A1	B1	A2	T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP1.2	B2	A1	B1	T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP1.3	A2	B2	A1	T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP1.4	B1	A2	B2	T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP1.5	A3	B3	A4	B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP1.6	B4	A3	B3	A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP1.7	A4	B4	A3	B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP1.8	B3	A4	B4	A3	T	B1	A2	B2	A1	

Aberrations

Aberrations sur l'axe	A1	S1.10	On-axis aberrations
Aberrations de champ	A2	S1.4	Off-axis aberrations
Zygo	A3	S1.2	Zygo
HASO	A4	S1.8	HASO

ven. 6 janv.

Groupe TP 2 (mardi) - 22 élèves										
Séance	Séquence 1			Séquence 2						
	mar. 24 janv.	mar. 31 janv.	mar. 7 févr.	mar. 28 févr.	mar. 7 mars	mar. 14 mars	mar. 21 mars	mar. 28 mars	mar. 4 avr.	mar. 11 avr.
CR	mar. 31 janv.	mar. 7 févr.	mar. 14 févr.	mar. 7 mars	mar. 14 mars	mar. 21 mars	mar. 28 mars	mar. 4 avr.	mar. 11 avr.	
TP2.1	A1	B1	A2	T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP2.2	B2	A1	B1	T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP2.3	A2	B2	A1	T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP2.4	B1	A2	B2	T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP2.5	A3	B3	A4	B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP2.6	B4	A3	B3	A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP2.7	A4	B4	A3	B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP2.8	B3	A4	B4	A3	T	B1	A2	B2	A1	

Détecteurs et bruits | Detectors and noise.

Bruit dans un système de photodétection	B1	S1.20	Photodetection noise sources
Caractérisation d'un détecteur infrarouge	B2	S1.15	Infrared detector characteristic meas.
Etude d'un capteur CMOS industriel	B3	S1.24	CMOS sensor
Caméra infrarouge	B4	S1.28	Thermal camera

Rotation de TP - Semestre 8 | 2022-2023 - Semestre 8 | 2022-2023

ven. 6 janv.

Groupe TP 3 (lundi) - 22 élèves

Séquence 1

Séquence 2

Séance	lun. 23 janv.	lun. 30 janv.	lun. 6 févr.		lun. 27 févr.	lun. 6 mars	lun. 13 mars	lun. 20 mars	lun. 27 mars	lun. 3 avr.	lun. 10 avr.
CR	lun. 30 janv.	lun. 6 févr.	lun. 13 févr.		lun. 6 mars	lun. 13 mars	lun. 20 mars	lun. 27 mars	lun. 3 avr.	lun. 10 avr.	
TP3.1	A1	B1	A2		T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP3.2	B2	A1	B1		T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP3.3	A2	B2	A1		T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP3.4	B1	A2	B2		T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP3.5	A3	B3	A4		B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP3.6	B4	A3	B3		A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP3.7	A4	B4	A3		B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP3.8	B3	A4	B4		A3	T	B1	A2	B2	A1	

Aberrations

Aberrations sur l'axe	A1	s1.10	On-axis aberrations
Aberrations de champ	A2	s1.4	Off-axis aberrations
Zygo	A3	s1.2	Zygo
HASO	A4	s1.8	HASO

ven. 6 janv.

Groupe TP 4 (jeudi) - 21 élèves

Séquence 1

Séquence 2

Séance	jeu. 26 janv.	jeu. 2 févr.	jeu. 9 févr.		jeu. 2 mars	jeu. 9 mars	jeu. 16 mars	jeu. 23 mars	jeu. 30 mars	jeu. 6 avr.	jeu. 13 avr.
CR	jeu. 2 févr.	jeu. 9 févr.	jeu. 16 févr.		jeu. 9 mars	jeu. 30 mars	jeu. 23 mars	jeu. 30 mars	jeu. 6 avr.	jeu. 13 avr.	
TP4.1	A1	B1	A2		T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP4.2	B2	A1	B1		T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP4.4	A2	B2	A1		T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP4.4	B1	A2	B2		T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP4.5	A3	B3	A4		B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP4.6	B4	A3	B3		A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP4.7	A4	B4	A3		B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP4.8	B3	A4	B4		A3	T	B1	A2	B2	A1	

Détecteurs et bruits | Detectors and noise.

Bruit dans un système de photodétection	B1	s1.20	Photodetection noise sources
Caractérisation d'un détecteur infrarouge	B2	s1.15	Infrared detector characteristic meas
Etude d'un capteur CMOS industriel	B3	s1.24	CMOS sensor
Caméra infrarouge	B4	s1.28	Thermal camera

